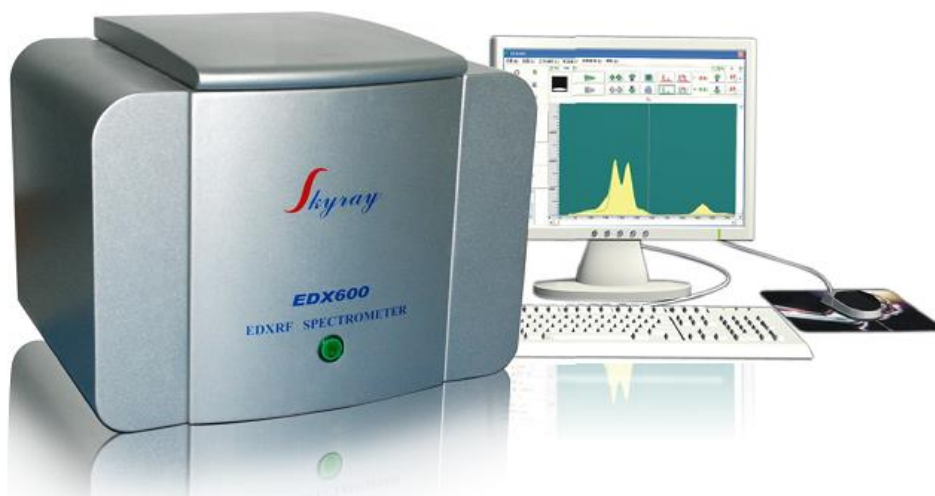


Spektrometr XRF EDX 600



EDX600 to efekt wieloletniego doświadczenia firmy SkyRay Instruments w projektowaniu urządzeń do analiz stopów i produktów z metali szlachetnych. Posiada ergonomiczny wygląd, przyjazny użytkownikowi interfejs i profesjonalne oprogramowanie sprawiające, że analizy pierwiastkowe w przemyśle jubilerskim stają się proste i szybkie.

EDX600 posiada wydajny i praktyczny licznik proporcjonalny zapewniający dokładne pomiary składu stopów jubilerskich przy zachowaniu niskich kosztów zakupu i eksploatacji. Sprawdza się też przy pomiarach grubości prostych powłok jednowarstwowych. Wykonany jest z trwałych materiałów, posiada potrójny system zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym.

Cechy produktu

- Przeznaczony do analiz metali szlachetnych i grubości warstw stopów
- Polecany szczególnie do analiz typowych stopów złota i srebra
- Inteligentne oprogramowanie do analizy metali szlachetnych w pełni kompatybilne z analizatorem.
- Dodatkowe oprogramowanie do pomiaru grubości powłok galwanicznych., umożliwiające identyfikację powłoki oraz pomiar jej grubości.



Specyfikacja techniczna EDX 600

Model	EDX 600, spektrometr EDXRF do analiz metali i powłok jubilerskich
Detektor	Licznik proporcjonalny, kolimator 1 mm do pomiarów małych powierzchni
Źródło wzbudzenia	lampa rentgenowska, geometria z dolnym źródłem promieniowania i detekcji
Prąd lampy	50-1000 μ A
Napięcie lampy	5-50 kV
Czas analizy	60-100 s
Mierzone pierwiastki	Standardowo Au, Ag, Pt, Pd, Cu w typowych stopach jubilerskich
Grubość powłok	Pomiary grubości prostych powłok jednowarstwowych jak Ag/Cu, Zn/Fe, Sn/Cu.
Stabilność pomiaru (względne odch. std.)	+/- 0,1%(zawartość głównego składnika ponad 96%) 0,01 μ m~0,05 μ m (w analizie powłok)
Zakres analizy powłok	od 0.005-0.01 μ m do 50 μ m (w zależności od rodzaju powłoki)
Dokładność pomiaru	5-10% wartości pomiarowej dla powłok galwanicznych
Formy próbek	ciała stałe, proszki, ciecze, powłoki galwaniczne
Pozycjonowanie próby	Celownik laserowy, kamera CCD do podglądu próbki w czasie rzeczywistym, dodatkowe uchwyty dla próbek małych i nieregularnych.
Zasilanie	220 VAC +/- 5V (zalecane źródło stabilizowane)
Warunki pracy	Temperatura robocza: +5 °C do + 30 °C, wilgotność powietrza \leq 70%
Konfiguracja standardowa	Komora pomiarowa, celownik laserowy, licznik proporcjonalny, lampa rentgenowska 50W, zestaw uchwytów i platforma pomiarowa, komputer PC z Windowsem, MSOfficem i oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i analizy danych.

Zastrzegamy możliwość zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji

Zastosowania

- Analizy metali szlachetnych w próbach jubilerskich
- Pomiary grubości powłok i określanie ich składu
- Badania w procesach technologicznych w przemyśle jubilerskim
- Sklepy, hurtownie punkty skupu biżuterii i kruszców

